

CEI 60749-11  
(Première édition – 2002)

**Dispositifs à semiconducteurs –  
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 11: Variations rapides de température –  
Méthode des deux bains**

IEC 60749-11  
(First edition – 2002)

**Semiconductor devices –  
Mechanical and climatic test methods –**

**Part 11: Rapid change of temperature –  
Two-fluid-bath method**

## CORRIGENDUM 1

Page 10

Tableau 1 – Tolérances de températures  
de choc thermique et fluides suggérés

*Sous A – Température  
Dans rangée* Etape 2 – Tolérance de  
température

*Au lieu de:*  $-40_{-30}^0$  ,

*lire:*  $-40_{-10}^0$  .

Page 11

Table 1 – Thermal shock temperature  
tolerances and suggested fluids

*Under A – Temperature  
In row* Step 2 – Temperature tolerance

*Instead of:*  $-40_{-30}^0$  ,

*read:*  $-40_{-10}^0$  .